

ライカ
Leica 2023年2月トピックス

異物を狙った断面・切片作製で、生産性向上・工程改善に効果抜群！

見ながら切れる
「サイドビューシステム」&「ミクロトーム」

塗膜の異物やフィルムのフィッシュアイなど、異物を狙って切削する際に、

切り過ぎて異物を
紛失してしまった

慎重になりすぎて、
多大な工数、時間がかかる

ミクロトームと顕微鏡作業を
何度も行き来して苦労している

などお困りではありませんか。

ライカユニークなソリューションが、お役に立ちます。

ライカトータルソリューションで異物解析・不良解析

異物の確認

ライカマイクロシステムズ
実体顕微鏡シリーズ



サンプル採取

前処理
切削・断面出し

ライカマイクロシステムズ
全自動回転式ミクロトーム
HistoCore NANOCUT R



観察

ライカマイクロシステムズ
金属顕微鏡、偏光顕微鏡
デジタルマイクロスコープ



画像解析

FT-IR、SEM-EDXなど
ライカマイクロシステムズ
顕微鏡LIBS、DM6 M-LIBS



こんなお客様にご利用いただいています

幅広い分野の民間企業様にご利用いただいています。

- 自動車
- 自動車部品
- エレクトロニクス
- 電子部品
- 通信
- 光ファイバー
- 電線
- 半導体
- 基板
- ガラス
- セラミックス
- 樹脂
- 化成品
- 医療機器部品
- フィルム
- 容器包装
- 医療品包装
- 製紙
- 顔料
- インク
- 印刷
- 繊維
- など

こんなニーズをお持ちのお客様に

- 工業用に様々な部品・基板などを製造している
- 異物解析・品質管理・新規素材開発などをおこなっている
- FT-IRやSEM観察の試料前処理効率をアップしたい
- 試料切片や断面の作製にてこずっている
- 装置の選択で迷っている

「切削・断面出し」強カツール: ミクロトーム NANOCUT R

試料の顕微鏡観察や分析を行うため、前処理として、試料の断面（経節に例えると、削り口）を出す、あるいは試料を極薄の切片（経の削り節）にする必要があります。

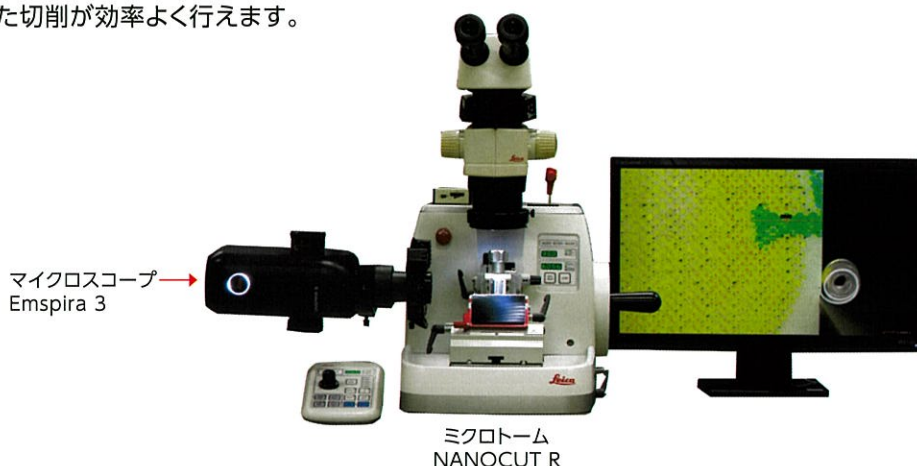
工業系試料は、形状、硬さ、材質などが多岐にわたり、切片や断面の作製に苦勞するケースも多々あります。切片・断面の作製に使用されるツールが、試料をマイクロメートル単位の厚さで均一に切る「**ミクロトーム**」です。



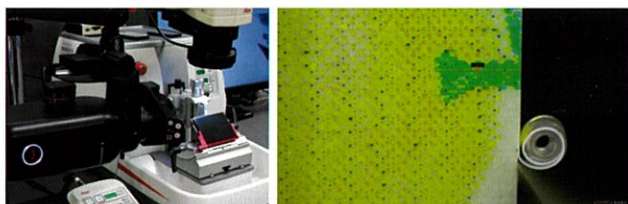
側面・断面を確認しながら切削: デジタルマイクロスコープ Emspira 3

ミクロトームNANOCUT Rの実力をさらに向上させるのが、「**マイクロスコープ**」の併用です。

サンプルはホルダに挟んだまま、真横、手前からなど好きな位置から観察できます。異物や微細加工を狙った断面出し、および欠陥箇所を狙った切削が効率よく行えます。



■ サイドビューシステム (印刷されたフィルム試料の切削例)



- 切削しながら、断面から異物までの距離をリアルタイム観察でき**安心**
- 断面から異物までの距離をライブ測定、ミクロトームのカウンター機能と組み合わせて、切削厚を算出でき、異物付近まで**すばやく**切り進められる
- 異物の真ん中で切られた状態を、マウス操作ですぐ**画像保存**できる
- 切削のたびに断面を連続撮影して、**三次元的に異物を解析**する用途にも応用可能

テストデータ取得ご依頼、問い合わせは私まで、お気軽にお声がけください。

デモ・お見積りなどお問合せください。
リモートデモも対応しております。
Email: lmc@leica-microsystems.co.jp
<https://xlab.leica-microsystems.com/inquiry>



メルマガ登録はこちらから
業務・作業の効率化に役立つ
顕微鏡知識をお届けしています。



ライカ マイクロシステムズ 株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9
Tel.03-6758-5656 Fax.03-5155-4333

※この製品のデザインおよび仕様は改良などのために予告なく変更する場合があります。